

海外科學技術動向

李 根 誠*

■■■ 컴퓨터 및 에너지 ■■■

■ 차례 ■

- | | |
|-----------------------------------|---------------------|
| ◇ 10倍의 메모리密度가 가능한 接觸엘리멘트인 磁氣버블메모리 | ◇ 새로이 出現한 動的 文字認識技術 |
| ◇ 칩上에서 最新의 컴퓨터인 마이크로메인프레임 | ◇ 超高速燒純 |
| ◇ 조선소컴퓨터技術의 評價 | ◇ 燃料와 將來 |

■ 10倍의 메모리密度가 가능한 接觸
엘리멘트인 磁氣버블메모리

新世代의 接觸엘리멘트인 磁氣버블메모리는 從來
퍼머로이체프론 磁氣버블메모리의 約 10倍程度의 情報을 蓄積할 수 있으며 또한 標準포토리소그라피技術
로서 製造할 수 있다고 한다.

開發中인 接觸엘리멘트메모리의 메모리密度는 $4\text{ Mb}/\text{cm}^2$ 로서 現在 프로세스로서 $16\text{ Mb}/\text{cm}^2$ 密度를 5年
以內에 實現할 수 있으며 어떤 타입의 接觸디스크메모리가 半導體메모리등과 對抗할 수 있나하는 것은 아직
不明確하나 적어도 $4\text{ Mb}/\text{cm}^2$ 칩이 商業化된 時點에서
이 새로운 接觸엘리멘트메모리가 퍼머로이체프론메모리로 代置된다고 한다.

또한 接觸디스크메모리도 체프론디스크로서 가아네
트의 逆磁化小領域에서 데이터를 蓄積할 수 있으나
버블의 動作機構는 메모리形態에 의해서 전혀 다르며
퍼머로이체프론메모리에서의 버블은 퍼머로이엘리멘트
中을 進行하는 포텐셜우물에 의해서 動作하는데 反하여
接觸디스크메모리의 버블은 回轉荷電壁에 의해서 動

作한다.

퍼머로이回路의 경우 스케일다운으로서 보다 적은
것수와 高密度를 實現하기 위하여 回路패턴의 一部를
버블直徑의 數分의 1(例을 들면 1/2~2/3)의 것수로
할必要가있으며 1 μm 直徑의 버블에서는 1 μm 以下의 것
수가 必要하다는 缺點이 있다.

이러한 缺點을 克服하는方法으로서 IBM이나 Bell研
究所에서는 接觸디스크버블回路를 開發하고 있으며 버
블은 回路패턴F에서가 아니고 回路패턴E에 따라서 움
직이므로 리소그라피는 버블直徑보다 커 良好하며 1 μm
直徑버블로서 $4\text{ Mb}/\text{cm}^2$ 의 메모리密度가 可能하다고 한다.

그리고 接觸디스크메모리에서의 패턴은 金 또는
포토레지스트로서 主로 表面가 네트層의 磁氣特性을
變更시키기 위한 이온注入用의 마스크가 되는데 이 層
은 버블메모리膜에서 磁氣의으로 變化하는 部分 또는
버블支持層의 表面에 成長시킨 第2의 애피택션가네트
膜이 되는 것이다.

接觸디스크磁氣버블메모리에는 셀프어라인과 논셀프
어라인(뉴얼레벨)의 2가지 形이 있으며 셀프어라인타입
에서는 콘트롤導體와 傳播트랙(接觸디스크波狀패턴)間에
臨界어라인엔트가 없으며 버블은 V形導體의 노치
에서 發生된다. 또한 가네트드라이브層은 結晶軸에 대한
導體의 方位때문에 強한 正電荷壁이 V中에 形成되

* 正會員：高麗大 工大 電子工學科 講師

는데 이 電荷壁은 플렉스漏洩을 招來하여 버블發生臨界值를 顯著하게 低下시킨다.

實際로 電荷壁은 버블發生에 必要한 필드의 約 50%

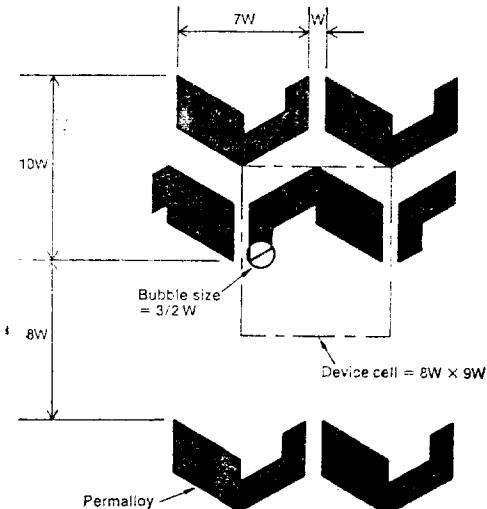


그림 1. 非對稱形 퍼머 로이치 프론裝置

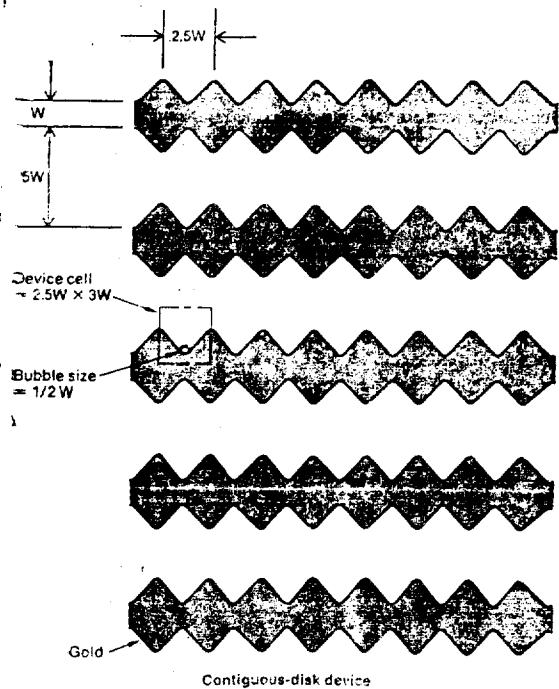


그림 2. 接觸形 디스크裝置

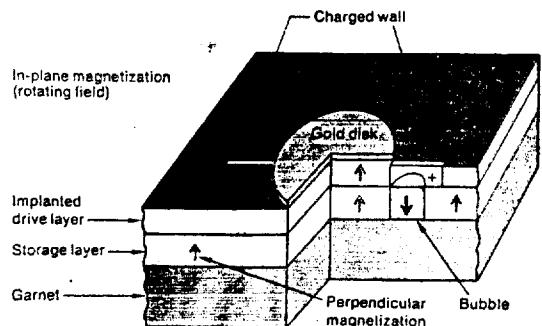


그림 3. 헬륨이온으로 形成된 傳播經路

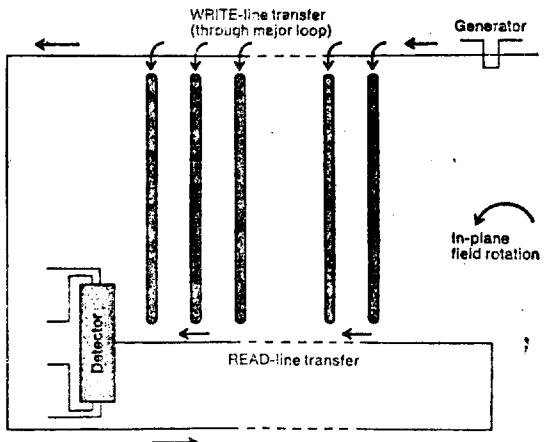


그림 4. Major-minor loop排列에 매력있는 G루우프

분이相當하여導體를 흐르는電流에 의해서 나머지 필드를 만드는데 버블은復部에서 잡아끄는 電荷壁에 의해서發生場所로부터傳播되어 除去되어 셀프어라인 타입에서는 버블發生導體가傳播퍼런을形成하고 金屬化는必要없게된다.

또한 셀프어라인形에서는 餘分의發生필드를 만들기 위하여傳播트랙上에 分離된 헤어핀狀의導體를設置하였는데隣接페인間의버블遷移는 셀프어라인形쪽이 약간複雜하다고한다.

芯片上에서 最新的 컴퓨터인 마이크 로 메인프레임

单一芯片上에 10萬個以上的 트랜지스터를 集積할 수 있어 다음世代의 마이크로 컴퓨터는 이러한 超 LSI 技

術을 使用할 수 있을 것이며 이미 미니컴퓨터에서는 32 bit 또는 64 bit의 機種이 出現하고 있다.

한편 마이크로컴퓨터는 16 bit機種이 市場에 나와 있으며 81年 2月에 뉴욕에서 開催된 世界半導體回路會議에서는 32 bit의 마이크로프로세서 칩에 대하여 4구룹이 發表하였다.

이것은 Intel社, Hewlett-packard社, Bell研究所 및 National Semiconductor社로서 Intel과 National Semiconductor에서는 81年末에 發賣하였으며 其他 會社에서는 自會社製品만을 使用할 豫定이다. 이 中에서 注目되는 것은 優秀한 集積回路技術을 갖는 Intel社의 아키텍처와 미니컴퓨터 및 科學機器分野에서 優秀한 技術을 갖고 있는 Hewlett-packard社로서 이것은 10, 個以上的 트랜지스터를 한 칩上에 集積하는 微細化技術에 依한 것이라고 한다.

Intel社는 32 bit의 마이크로프로세서를 開發하기 위하여 5年間과 2,000萬弗以上의 費用이 必要하였으나 Intel社의 프로세서는 마이크로컴퓨터의 原價로서 미니컴퓨터의 性能을 갖으로 마이크로프레임이라고 부른다.

한편 超 LSI에 의한 아키텍처의 長點은 高階言語를 中心으로 한 프로그램으로서 高階言語를 從來의 어셈블리言語와 比較하면 5程程度의 프로그램作成效率을 얻을수있는데 高級言語로서는 美國國防省의 컴퓨터言語인 Ada를 使用하고 있다. 그런데 Ada는 큰 프로그램을 스트럭처 技法에 의해서 分割하고 記述할 수 있는 特徵을 갖고있다.

또한 마이크로메인프레임의 프로그램作成上의 特徵은 마진中을 情報가 어떻게 흐르는가를 意識하지 않아도 좋으며 또한 오브젝트指向아키텍처로서 오브젝트는 컴퓨터메모리에 記憶된 操作계이터이다.

한편 오브젝트指向아키텍처에 의한 프로세서의 能力向上으로는 透過性 多重處理라고하는 것이 있는데 多重處理는 2個以上の CPU가 並列로 同一프로젝트를 實行하는 것으로서 多重處理는 高效로서 實行되어 JOB을 CPU로서 分割하여 演算時間은 短縮할 수 있다.

오브젝트指向아키텍처는 프로그래머가 몇 臺의 CPU가 있는가를 알지못해도 JOB을 分割해서 處理할 수 있는 透過性을 갖고 있으며 CPU의 多重化는 여러臺의 32 bit프로세서를 接續해서 中形 미니컴퓨터로부터 中形메인프레임미니 컴퓨터의 能力까지 擴張시킬 수 있다.

더욱이 아키텍처의 長點은 마이크로프로세서에 하드웨어形으로 오퍼레이팅시스템으로서 소프트웨어를 組込할 수 있는데 오퍼레이팅시스템은 마이크로코오드形으로 集積回路化되어 있으며 能率이 良好한 多重處理

를 實行하고 있다.

Intel社의 32 bit프로세서는 115萬個와 62萬個의 트랜지스터로 構成된 2chip으로서 汎用 테이터프로세서로 되어 있다. 그런데 Hewlett-packard社의 프로세서는 폐면幅이 $1.5\mu\text{m}$ 이나 Intel社의 것은 폐면幅이 $3\mu\text{m}$ 로 되어 있다.

조셉슨컴퓨터技術의 評價

조셉슨컴퓨터 技術의 將來性은 其他 技術로는 到達할 수 없는 超高性能뿐만 아니라 실리콘技術이 到達하고 있는 性能領域에서는 價格面에서 充分히 競合할 수 있는 것이다. 또한 조셉슨技術을 現在의 컴퓨터시스템과 試驗評價하기 위하여 Josephson電流注入論理(CIL)回路패밀리와 캐쉬메모리設計를 使用하여 이것을 IBM 3033 메인프레임아키텍처 的으로 寫像하였으며 프로세스사이클 타임을 比較하기 위하여 IBM 3033 메인프레임의 캐쉬어드레스 發生과 命令取出動作의 經路를 選定하였다. 動作은 3사이클을 必要로 하는데 IBM 3033에서는 이 傳播距離는 847.0cm로서 全遲延은 157.57ns가 된다.

조셉슨回路에 있어서 페레이어의 基本은 1,000論理回路 또는 4,000 bit의 非破壞讀出 캐쉬어래 이를 收容할 수 있는 $6.3 \times 6.3\text{mm}$ 실리콘침으로서 4개의 論理침(메모리인 경우 8個)을 실리콘 回路케리어의 兩面에 附着한 것이다 크기는 $15 \times 30\text{mm}$ 이다.

또한 全캐쉬메모리容量을 64K byte로 維持하고 메인메모리容量을 8倍의 64M byte로 하면 完全한 메인프레임은 2,555個의 回路케리어上에 40,514침을 페레이어

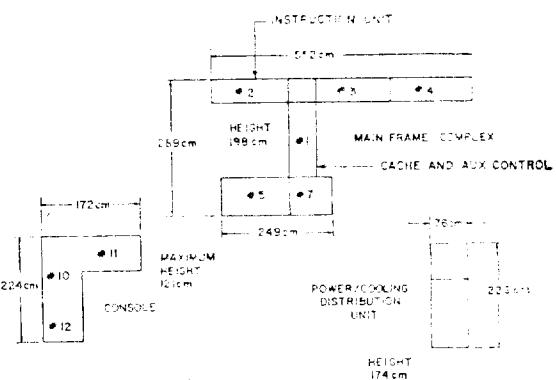


그림 5. IBM 3033 12채널, 8메가비트 메인메모리에
관한 平面圖

지할 수 있으며 76소켓판에 差込되어 있다.

이 경우 傳播距離와 遲延時間 을 計算하면 54.04cm이다.

11,910ns가 되는데 IBM 3033과 比較하면 傳播距離는 約 6%가 되고 動作은 14倍以上으로 빠르다. 冷却電力

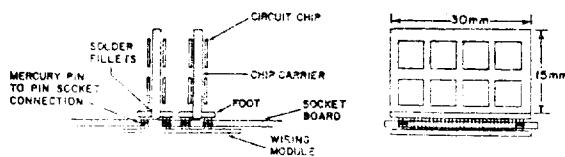


그림 6. 조셉슨패키징의 端部 및 側面

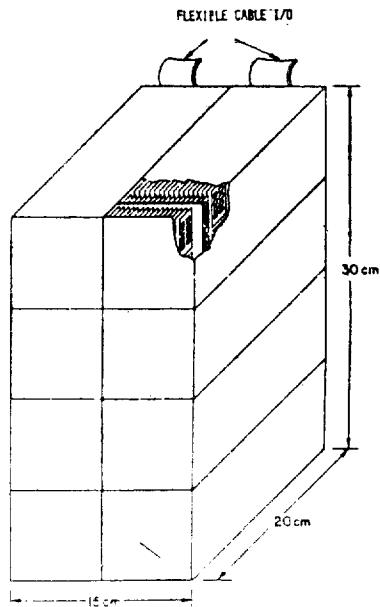


그림 7. IBM 3033主프레임에 있어서 假想의 조셉슨技術의 패키지

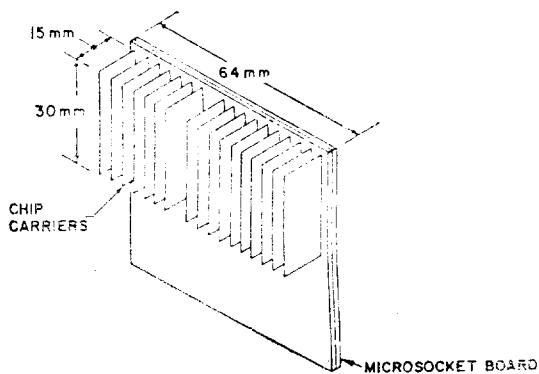


그림 8. 假想의 조셉슨主프레임의 서브세트

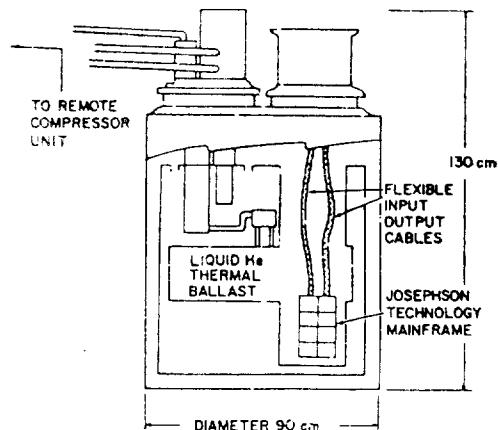


그림 9. 假想의인 조셉슨技術試作에 必要한 極低温冷却器

도 考慮하면 조셉슨에인프레임은 約 15KW을 消費하는데 反하여 IBM 3033은 回路消費電力 50KW以外에 冷却과 空調때문에 140KW가 必要하다고 한다.

以上의 分析으로 보아 조셉슨技術은 超高性能에인프레임에 관한限 比較가 안되는 優秀한 點이 있으며 IBM 3033의 性能領域에서도 이와같은 事實은 變함이 없을 것이다.

■ 새로이 出現한 動的 文字認識技術

動的文字認識(Dynamic Character Recognition)은 手書데이터를 直接 컴퓨터에 入力하고 이것을 認識하는 技術이다. 이 技術은 1957年 以來 積極的으로 追究되었으며 今日에는 處理와 메모리의 費用低減에 의해서 實施되고 있다.

한편 DCR은 온라인 리얼 타입의 文字認識으로서 普通大文字의 A~Z와 0~9을 對象으로 하고 있으며 DCR 시스템은 一般으로 入力, 處理 및 表示의 各 裝置로構成되어 있다. 드한 入力裝置로서 가장 多이 使用되는 것은 그레피디블레트로서 이것은 鉛筆이나 펜의 位置를 超音波, 靜電氣, 磁氣歪 및 電氣抵抗 등으로 檢出하는데 이 信號는 마이크로프로세서와 메모리로構成된 處理裝置로 보내어져 前處理와 認識이라는 過程으로 處理된다.

前處理는 데이터를 平滑化 해서 濾波하는데 平滑化는 隣接點의 位置와 各 點의 位置를 平均化함으로서 데이터의 ジ이터와 같은 不規性을 除去하여 또한 濾波는 不必要한 點을 除去해서 記憶과 處理容量을 節減한

다.

認識 알고리즘에는 2개의 基本形 즉 教育可能形學習하는 시스템과 教育不能形이 있는데 前者は 手書文字를 入力해서 識別하는 것을 利用者가 하여야 되며 이 시스템은 例示된 文字에서 特徵을 抽出하여 識別 때문에 이들의 特徵을 利用하는데 後者は 特定한 어느 利用者の 書體에 관해서 事前의 知識을 갖고 있지 않다.

以上의 2개 시스템에 있어서 認識 알고리즘은一般的으로 特徵抽出과 認識의 段階도 構成되어 있다. 또한 大部分의 시스템에 있어서 주어진 入力文字에 관해서 檢出된 特徵은 文字 클래스의 分類에 관해서 確立되어 있는 特徵 테이블과 比較된다. 前者の 시스템에서는 이 테이블은 教育中 일어진 實際의 測定值도 얻을 수 있으며 後자의 시스템은 文字와 各 클래스의 字體에 의한 關連을 必要로 함으로 大概의 경우 大形化되고 있다.

未知의 文字는 特徵 테이터와 比較되어 이 出力은 어느 臨界值以上이 되면 이 文字는 認識되어 CRT나 LED의 表示裝置上에 表示된다.

한편 DCR 시스템은 人間機械인터페이스를 크게 改善하며 從來 키이보드方式의 레이저 입력은 2人以上的 人間을 必要로 하나 DCR은 1人으로서 同一한 것을 達成할 수 있다. DCR의 特徵은 費用節減과 迅速한 터언 어라운드 및 低誤率을 들을 수 있으며 價格은 3,000~1萬2,000弗이라고 한다.

■ 超高速 燒鈍

現在 실리콘의 缺陷燒鈍이나 不純物擴散에 利用되는 數十分에 미치는 高溫爐處理는 高出力레이저 또는 電子비임프로세스가 開發된다면 밀리秒 또는 마이크로秒까지 短縮할 수 있으며 이 基本的인 프로세스는 半導體材料를 高速으로 加熱, 冷却할 수 있다고 한다.

이 方法에 의하면 連續動作의 레이저 비임으로 실리콘레이저를 走查하여 表面層의 20μ 를 約 10밀리秒로서 固相의 原子配列을 일으키는 溫度까지 加熱해서 燒鈍效果를 얻을 수 있다. 그런데 普通熔融程度는 아니나 900°C 近方로 加熱하면 이 溫度에서 結晶의 固相에 파티설成長이 約 $10\mu/\text{s}$ 의 速度로 일어난다.

따라서 0.05μ 의 厚層은 레이저스포트의 滯在時間 5밀리秒로서 完全히 再成長시킬 수 있으며 $1,000^{\circ}\text{C}$ 가 되면 再成長速度는 10倍가 된다고 한다.

한편 펄스動作의 레이저비임에서는 20나노秒 以下에서 表面이 融點以上으로 到達하여 數百나노秒間은 液

體그대로 있어 이 時間에 再凝固가 일어나며 結晶은 $1\text{m}/\text{s}$ 의 速度로 成長된다. 이와같이 局部的인 熔融 및 再固體化로서 周圍領域을 摾亂시키지 않고 缺陷이 많은 또는 非晶質의 材料로부터 單結晶을 만들 수 있다.

레이저와 電子비임 技術은 웨이퍼의 汚染과 橫方向의 歪를 低減할 수 있으며 레이저인 경우 非真空으로 세서 때문에 費用이 低減된다.

다음에 非晶質基板上의 單結晶半導體材料의 成長도 興味가 있는 應用分野로서 적은 粒域etching法의 실리콘을 連續動作레이저로서 走查하고 스콧트의 溫度를 실리콘의 融點以上으로 올리므로서 큰 結晶粒을 만들 수 있다.

또한 全體의 粒域이 同一 結晶方位를 갖으며 이 칫수를 擴大해서 單結晶을 形成하는 研究를 進削시키고 있으며 SiO_2 또는 Si_3N_4 膜上의 CVD(chemical vapor-deposited)非晶質 또는 폴리실리콘으로부터 結晶실리콘을 만들 수 있고 3次元 IC의 構成을 實現할 수 있다고 한다. 例를 들면 單結晶이 아니더라도 폴리실리콘을 燒鈍해서 큰 結晶粒으로 하므로서 電氣的 特性을 單結晶層으로 接近시킬 수 있어 매우 有用하다는 것이다.

非晶質 또는 多結晶基板上에 低廉하게 化學的으로 沈着시킨 Ge부터 Ge結晶膜을 만들면 이 위에 GaAs膜을 애피택成长으로 할 수 있으므로 太陽電池의 製造コスト를 劇的으로 低減시킬 수 있다. 또한 非晶質에서 結晶의 轉換은 레이저프로세스에 의해서 可能한데 基板을 300°C 以上으로 豫備加熱하면 結晶화가 自己維持의 으로 進行된다. 또한 非晶質層의 一部가 結晶으로 轉換되면 膜全體로 擴大된다고 한다.

또한 다른 方法으로서 結晶材料上의 非晶質膜을 펄스레이저로서 下部의 結晶域까지 熔解되고 있으며 單結晶으로서 成長된 高效率太陽電池製造의 研究도 進行되고 있다.

그리고 레이저프로세스를 使用하면 실리콘結晶이 液相으로부터 成長하는 速度가 매우 빠르므로 平衡熔解度를 한층 超越하는 高濃度의 不純物을 結晶格子點으로 導入할 수 있고 太陽電池와 其他 디바이스의 抵抗을 踏下시켜서 性能을 向上시킬 수 있다.

GaAs太陽電池製造프로세스에 있어서 其他 레이저應用으로서 接觸電極用 Ge-GaAs複合合金膜의 形成이나 이온注入後의 損失이 적은 燒鈍이 있으며 SOSMOS트랜지스터의 SOS層이나 MOSFET의 셀프어터인이온注入 채널에 레이저燒鈍을 適用해서 特性改善를 얻을 수 있다고 한다.

그리고 레이저와 電子비임 프로세스를 技術習熟度의 觀點에서 본다면 固相프로세스에 의한 燒鈍은 이미 確

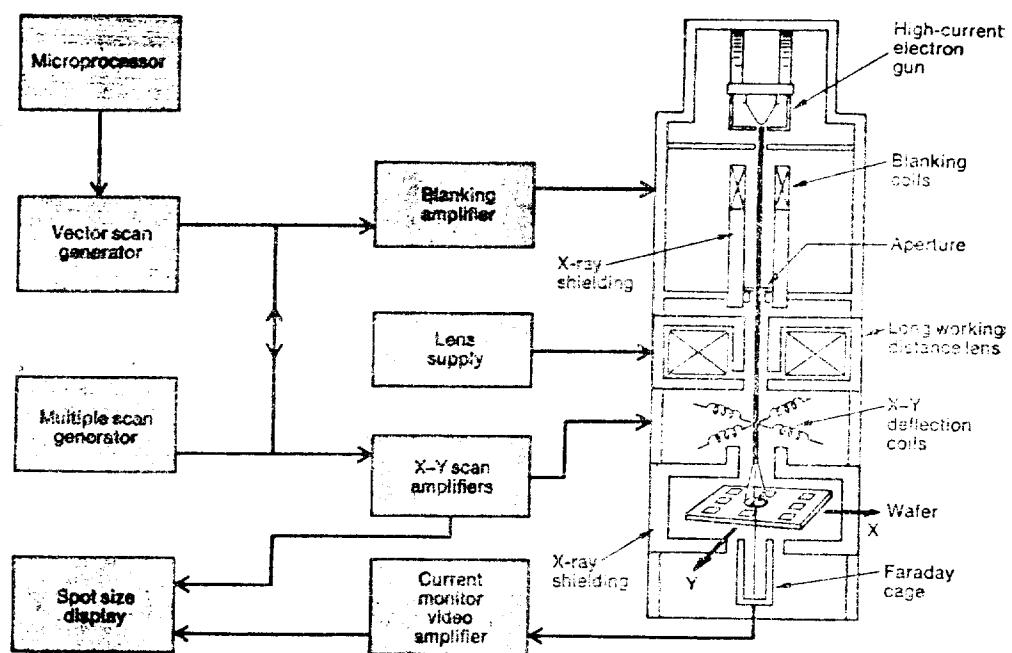


그림 10. 레이저어나링 方式과 비슷한 制御構造를 갖는 電子비임어널링

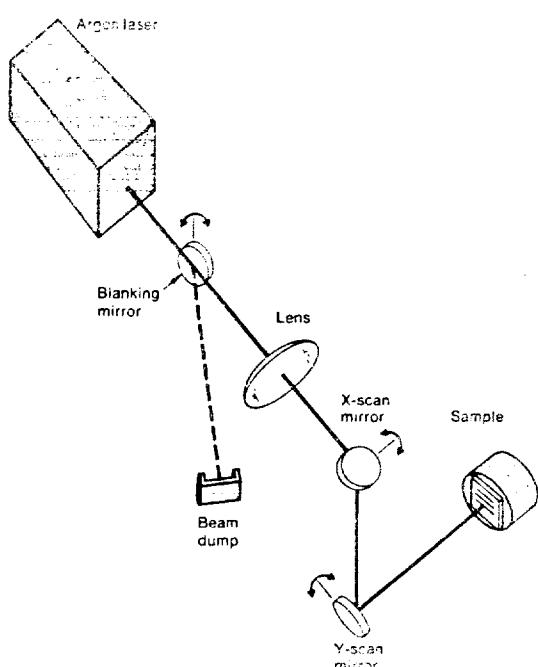


그림 11. 2개의 거울도 制御되는 레이저어널링비임의 位置

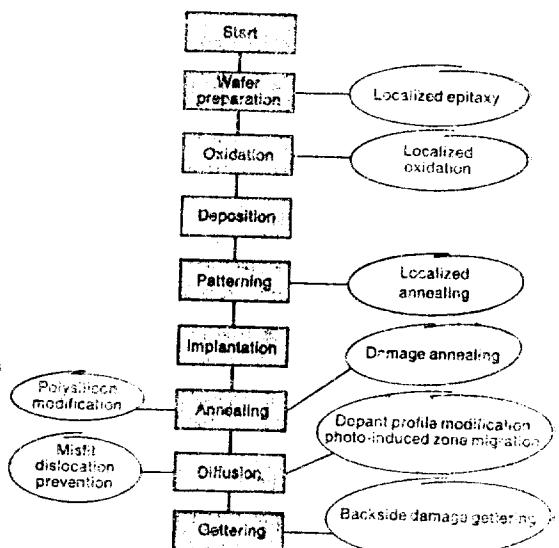


그림 12. 레이저 또는 電子비임 프로세싱

표 1. 爐어닐링 및 레이저에 의한 固相, 液相再成長의 比較

	Furnace	CW Laser	Pulsed Laser
Regrow mechanism	Solid-phase epi	Solid-phase epi	Liquid-phase epi
Anneal parameters	Regrowth takes place at less than 550°C. Regrowth quality depends on time and temperature	Regrowth quality depends on power and dwell time	Single crystal recovery above threshold power, poly below threshold
Dose dependence	High doses regrow poorly; for low doses of dopant, regrowth rate increases with dose	Same as furnace	Essentially no dose dependence
Orientation dependence	Poor regrowth for (111) orientation; best regrowth for (100) orientation	Same as furnace	No orientation dependence
Microstructure	Never completely defect free; some dislocations	Lower dislocation density than furnace	Perfect crystal: extended defect-free regions
Implant profile and substitutionality	No redistribution below solubility limit (above 850°C); normal diffusion above about 850°C; grain boundary out diffusion and "push out" occurs above solubility limit	No redistribution below solubility limit; same as furnace above solubility limit	Always redistribution within melt; zonerefining; substitutionality exceeds equilibrium values
Surface topography	Featureless	Usually featureless, but surface slip and cracking cause "overannealing" at (111) orientation	Appearance of frozenliquid; gross surface damage at excessively high laser powers

確立되어 있는 爐가스를 根本的으로 스피드업 할 수 있으므로 從來프로세스와 整合함으로서 利點을 찾을 수 있으며 高速走査된 電子ビーム은 웨이퍼 全體를 迅速히 加熱하는데 利用할 수 있다고 한다.

또한 液相프로세스는 最新技術로서 펄스레이저 또는 電子ビーム 溶融을 실리콘플래너 技術로서 實用上 應用할 수 있는데 唯一한 分野는 서브마이크로秒의 溶融時間과 이 結果 일어진 薄平行層形成의 プロ세스이다. 將次 3次元 IC의 利用이 展望되나 多數의 基本的인 研究課題을 克服해야 되며 이 中에서도 液相으로부터 生成되는 結晶의 制御가 가장 基本的인 問題도 남아 있다.

燃料와 將來

過去 10年間 化石에너지 源으로서 石炭의 將來性이 多方面에서 認定받고 있다. 現在 石炭을 液體燃料로 轉化시키고자 하는 研究가 많은 場所에서 進前되고 있으나 J.T. Dunn氏는 粉碎炭燃燒의 研究에 注力하고 있는 1930年代 보다도 實際로 일어나고 있는 產業規模의 變化가 적어 炭礮閉山의 數가 新規開山의 數를 上廻하고 있었고 또한 石炭液化企業을 일으키는 誘因이나 政

策이 世界 어느곳에서도 볼 수 없게 되었다고 한다.

또한 EC諸國이 直面하고 있는 큰 危險性은 1次에너지 消費量의 折半以上은 거의 全部石油로서 OPEC에서 輸入하고 있으며 앞으로 豫見되는 エネ지消費量의 增加는 原子力發電과 石炭輸入增加의 必要를 意味하게 되었다. 그리고 EC諸國뿐만 아니라 美國, 캐나다, 日本 및 오스트랄리아 등의 나라에서도 石炭의 依存度가 높아지고 있다.

만약 合成燃料plant가 世界的으로 年 1.6%率로서 擴大된다면 現在 1,000Mt의 世界石炭消費量이 2000년 까지는 3倍가 될것이며 이것은 EC諸國의 石炭需要量의 確保를 더욱 困難하게 할 것이라고 한다.

石炭價格은 需要와 供給이 平衡을 維持하는 동안에 生產價格과 關連되어 있으나 石油市場에서 본 수 있는 바와 같이 價格은 生產cost에 無關하게 된다. 日本은 오스트랄리아와 캐나다에서 石炭이나 오일웨일資源의 開發과 合成液體燃料의 生產에 參加하고 있으며 相對國의 鎳山이나 轉化plant 및 化學產業 때문에 裝置를 度給할 수 있게 되었고 엔지니어링의 도움을 받어서 OPEC에서 着手하지 않는 資源에 接近하고 있다. 한편 EC諸國도 以上과 같은 努力を 行하고 있으나 參加努力을 効果的으로 하기 위하여는 상당한 政府資金으로서 支援받는 콘소시움이 必要하게 될 것이다.

終身會費完納者 名單

(82. 3. 1 ~ 31) : 9名

會員番號	姓 名	所 屬	會員番號	姓 名	所 屬	會員番號	姓 名	所 屬
575079	李 仕 永	明知大 大學院	575073	李 輔 鍇	崇田大 工大 教授	263049	朴 鐏 寛	成均館大
701118	崔 圭 復	서울一般	575271	李 弘 植	韓國電氣通信(研)	575184	李 仁 榮	서울一般
575092	李 相 一	朝鮮 大工 大教授	125014	南 亨 祐	現代重工業(株)	575422	李 昌 奎	韓電社員研修院

終身會費分納者 名單

(82. 3. 1 ~ 31) : 19名

會員番號	姓 名	所 屬	會員番號	姓 名	所 屬	會員番號	姓 名	所 屬
141021	盧 載 和	산업기지개발공사	558047	尹 鍾 範	산업기지개발공사	575152	李 順 永	漢陽大
499048	吳 世 薫	"	122475	金 在 薫	"	070006	具 泰 萬	"
611009	全 重 機	합대광업소	832043	洪 鍾 明	"	844022	黃 有 模	高麗大
474001	延 大 鈸	光云工大	586013	任 國 彬	"	620061	鄭 義 南	三涉工專
453022	梁 海 元	明知大	141022	盧 淵 淑	"	429005	沈 相 興	"
585033	林 璞 坤	韓國機械研究所	018010	姜 文 盛	漢陽大			
610020	全 炳 三	산업기지개발공사	575432	李 基 善	"			

新規加入者 名單

〈正 會 員〉

(82. 3. 1 ~ 31) : 72名

會員番號	姓 名	所 屬	會員番號	姓 名	所 屬	會員番號	姓 名	所 屬
396037	宋 善 石	明知大	635011	曹 主 坤	서울一般	558048	尹 泰 源	청운중학교교사
832041	洪 淳 玎	"	499048	吳 世 薫	산업기지개발공사	122484	金 正 德	서울一般
122471	金 在 煥	韓國電力公社	141021	盧 載 和	"	122483	金 圓 基	漢陽大大學院
437035	安 承 鎮	한보주식	045020	高 賢 煙	忠南大	620119	鄭 用 澈	"
575430	李 永 日	明知大	474001	延 大 鈸	光云工大	586014	任 尚 照	"
122470	金 正 壪	롯데칠성(株)	348035	徐丙高	漢陽大	648008	朱鍾喆	"
122469	金 泰 淑	明知大	423037	申 仁 澈	檀國大	575432	李 基 善	"
575003	石 舜 基	"	453022	梁 海 元	明知大	575431	李 健 寧	"
701119	崔 鎮 源	"	122474	金 容 南	全北大	122482	金 賢 壓	"
634064	趙 成 甲	"	499049	吳 在 喆	"	122481	金 鎮 喆	"
453021	梁 泰 壽	"	585033	林 璞 坤	韓國機械研究所	122480	金 在 彥	"
122468	金 永 吉	"	832043	洪 鍾 明	산업기지개발공사	122479	金 榮 夫	"
610019	全 賢 植	"	610020	全 炳 三	"	122478	金 永 奉	"
575428	李 用 煕	明知大	586013	任 國 彬	"	122477	金 炳 泰	"
635010	曹 憲 圭	"	558047	尹 鍾 範	"	122476	金 奎 卓	"
575429	李 昇 遠	주택공사	141022	盧 淵 淑	"	575434	李 康 浩	대우공전
586012	任 哲 娜	축협중앙회	122475	金 在 薫	"	575433	李 善 永	高麗大大學院
701118	崔 圭 復	(주)日進	528016	禹 明 均	"	169003	都 鍾 均	"
832042	洪 東 雨	檀國大	294007	邊 斗 均	"	122485	金 榮 泰	"
018047	姜 斗 煥	서울大	284025	白 斗 錄	"	122486	金 學 敏	"
348034	徐 義 錫	"	263175	朴 哲 弘	"	558049	尹 泰 英	"
122472	金 國 憲	"	045021	高 根 植	"	018048	姜 仁 卓	"
424015	辛 圭 鐵	"	585034	林 生 根	신화건설(주)	437037	안 병 태	科學技術院
122473	金 鎮 吾	京畿一般	437036	安 熙 珍	연성공고교사	575435	이 은 주	"